

TLNC Nano Profiler

” Primárně určen pro analýzu rovinných optických prvků, náš TLNC profiler měří profil povrchů s přesností lepší než 200nm. “

Nabízíme univerzální bezkontaktní systém pro rychlou charakterizaci optických komponent. Primárně určen pro analýzu rovinných optických prvků, náš TLNC profiler měří profil povrchů s přesností lepší než 200nm.

Rychlá příprava, kalibrace, a také prostor pro další zákaznické úpravy činí náš systém vhodný pro průmyslové využití.

Úprava pro charakterizaci jiných než rovinných prvků je také možná po dohodě se zákazníkem.

VLASTNOSTI

- Rychlé a jednoduché bezkontaktní měření profilu
- Bez potřeby skenování
- Měření optických komponent o průměru až 80mm (větší rozměry na přání zákazníka)
- Charakterizace na vlnové délce 633nm (jiné vlnové délky na přání zákazníka)
- Přesnost lepší než 200nm
- Dynamický rozsah (max. P-V) až po 100um

